

First edition  
2003-07-15

---

---

**Surface chemical analysis — Secondary-ion mass spectrometry — Method for estimating depth resolution parameters with multiple delta-layer reference materials**

*Analyse chimique des surfaces — Spectrométrie de masse des ions secondaires — Méthode d'estimation des paramètres de résolution en profondeur à l'aide de matériaux de référence multicouches minces*



Reference number  
ISO 20341:2003(E)

© ISO 2003

**Pour plus d'infos, merci de nous contacter.**

**Association Sénégalaise de Normalisation**

4 Avenue Jean Jaurès, Immeuble El Hadj Omar DIA, 6 ème Etage  
Dakar - SENEGAL

**Tel: +221 33 829 58 25**

**Email: [asn@asn.sn](mailto:asn@asn.sn)**